

УДК 543.422.3 539 219.3

© 1990

## ЯМР $^{19}\text{F}$ И ИОННАЯ ПОДВИЖНОСТЬ В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ $\text{Na}_{1-x}\text{Y}_x\text{F}_{1+2x}$

А. Д. Тошматов, Ф. Л. Аухадеев, Д. Н. Терпиловский,  
В. А. Дудкин, С. Л. Кораблева, Л. Д. Ливанова

Импульсным методом ЯМР на ядрах  $^{19}\text{F}$  и кондуктометрическим методом исследовано тепловое движение ионов фтора в твердых растворах  $\text{Na}_{1-x}\text{Y}_x\text{F}_{1+2x}$  ( $0.50 \leq x \leq 0.64$ ), имеющих флюоритоподобную структуру, в области температур 290—970 К. Установлено, что при  $T > 400$  К происходит изотропное (не зависящее от направления магнитного поля) сужение линии ЯМР; изотропное и не зависящее от частоты увеличение скорости ядерной спин-решеточной релаксации, на которое не оказывает влияния присутствие быстро релаксирующих магнитных ионов  $\text{Nd}^{3+}$  (до концентраций 10%); значительное увеличение электропроводности  $\sigma_{390^\circ\text{C}} = 1.2 \cdot 10^{-3} \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$  для твердого раствора  $\text{Na}_{0.50}\text{Y}_{0.50}\text{F}_2$ . В исследованных твердых растворах можно выделить три типа движения ионов фтора  $\text{F}^-$ , имеющего диффузионный характер: быстрое с эзатальпийской активацией  $\Delta E_1 \approx 0.3$  эВ и два медленных с  $\Delta E_2 \approx 0.8$  и  $\Delta E_3 \approx 1.5$  эВ. Эти типы движения соотнесены с особенностями структуры твердых растворов.

Твердые растворы с общей формулой  $\text{Na}_{1-x}\text{Y}_x\text{F}_{1+2x}$  являются хорошими ионными проводниками. Как следует из наших результатов, а также работы [1], подвижность ионов фтора  $\text{F}^-$  в них весьма велика, что позволяет отнести их к твердым электролитам. В области существования твердых растворов  $0.50 \leq x \leq 0.64$  при увеличении  $x$  происходит гетеровалентное замещение  $\text{Na}^+ - \text{Y}^{3+}$  с одновременным внедрением дополнительных ионов фтора  $\text{F}^-$ , занимающих межузельные положения во флюоритоподобной структуре [1, 4]. При изовалентном замещении ионов  $\text{Y}^{3+}$  редкоземельными ионами указанные соединения становятся перспективными материалами лазерной техники [5]. Физические свойства твердых растворов  $\text{Na}_{1-x}\text{Y}_x\text{F}_{1+2x}$  изучены крайне слабо. В настоящей работе представлены результаты исследования подвижности ионов фтора  $\text{F}^-$  кондуктометрическим методом и методом ЯМР на ядрах  $^{19}\text{F}$ .

В работе [6] было показано, что сочетание двух указанных методов позволило получить подробную информацию о диффузионном движении ионов фтора  $\text{F}^-$  в монокристалле  $\text{KY}_3\text{F}_{10}(\text{K}_{0.25}\text{Y}_{0.75}\text{F}_{2.5})$ . Было установлено, что в кристаллических системах с высокой подвижностью ионов-носителей ядерного спина  $I=1/2$  важную роль в ядерной релаксации играют столкновения их с неподвижными, медленно релаксирующими электронными спинами  $S$ . В этой работе мы попытались ответить на вопросы, можно ли получить столь подробную информацию, как в [6], об ионном движении в твердых растворах и какова роль в ядерной релаксации  $^{19}\text{F}$  быстро релаксирующих неподвижных электронных спинов. В работах [1–4] различными методами были изучены изоструктурные твердые растворы состава  $\text{A}_{1-x}\text{Bi}_x\text{F}_{1+2x}$  ( $\text{A}=\text{Na}, \text{K}, \text{Rb}$ ). Наши исследования отличаются от [1–4] тем, что мы выполнили ЯМР измерения в более широкой температурной области, в результате чего удалось получить более полную информацию о ядерной магнитной релаксации  $^{19}\text{F}$  и подвижности ионов фтора.

# 1. Экспериментальные результаты

Образцы были выращены методом Бриджмена—Стокбаргера из реактивов  $\text{NaF}$  (ос. ч.) и  $\text{YF}_3$  (х. ч.) в графитовых тиглях в инертной атмосфере  $\text{Ar}$  со скоростью протяжки 1 мм/ч. Температура в зоне роста  $\sim 1000^\circ\text{C}$ . Рентгенограммы образцов указывают на существование флюоритоподобной фазы с параметрами ячейки (рис. 1).

Все экспериментальные результаты получены с помощью аппаратуры и методами, описанными в [6]. На рис. 2 представлены результаты измерения электропроводности в зависимости от температуры четырех образцов твердых растворов и кристалла  $\text{KY}_3\text{F}_{10}$ . Коэффициент электропроводности  $\sigma$  имеет наименьшее значение для упорядоченной структуры  $\text{KY}_3\text{F}_{10}$  и монотонно увеличивается в ряду твердых растворов. Максимальное

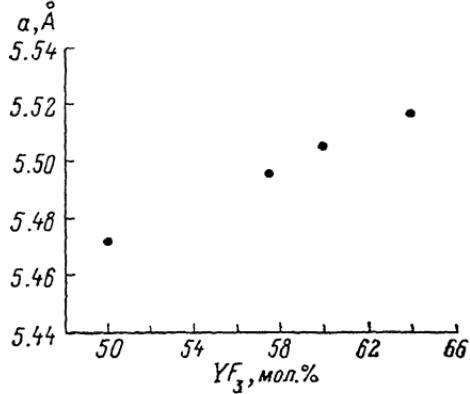


Рис. 1. Зависимость параметра решетки от состава твердого раствора  $\text{Na}_{1-x}\text{Y}_x\text{F}_{1+2x}$ .

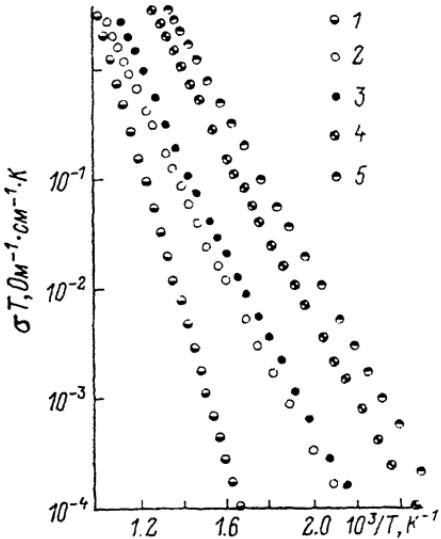


Рис. 2. Температурная зависимость электропроводности монокристалла  $\text{KY}_3\text{F}_{10}$  (1) и твердых растворов  $\text{Na}_{1-x}\text{Y}_x\text{F}_{1+2x}$  ( $x: 2 - 0.64, 3 - 0.60, 4 - 0.575, 5 - 0.50$ ).

значение  $\sigma$  наблюдается для состава  $x=0.5$  и превосходит примерно на четыре порядка значение  $\sigma$  для  $\text{KY}_3\text{F}_{10}$ .

Энタルпия активации диффузионного движения ионов  $\text{F}^-$ , определяющая перенос заряда в твердых растворах, не зависит от состава и равна  $0.8 \pm 0.04$  эВ, что меньше, чем у кристалла  $\text{KY}_3\text{F}_{10}$  ( $1.5 \pm 0.04$  эВ). Для твердых растворов двух наиболее близких к  $\text{KY}_3\text{F}_{10}$  составов ( $x=0.6, 0.64$ ) при высоких температурах наблюдается увеличение угла наклона кривых  $\ln(\sigma T)$  в функции величины  $10^3/T$ . Значение  $\sigma$  для твердого раствора с  $x=0.5$  равно  $1.2 \cdot 10^{-3} \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$  при  $T=660$  К, что на один порядок меньше  $\sigma$  для одного из лучших твердых электролитов  $\text{PbF}_2$  при той же температуре [7].

На рис. 3 показано, как изменяется с температурой ширина линии ЯМР  $^{19}\text{F}$  твердых растворов с  $x=0.6, 0.64$  и номинально чистого кристалла  $\text{KY}_3\text{F}_{10}$ . При низких температурах ширина линии  $\delta$  не зависит от величины постоянного магнитного поля  $H_0$ . Повышение температуры, однако, не приводит к частичному разрешению структуры линии ЯМР, как это имело место в кристалле  $\text{KY}_3\text{F}_{10}$  [6], а вызывает сужение всей линии, которое наступает при более низких температурах. Энталпия активации ионного движения  $\text{F}^-$ , приводящего к сужению линии, равна  $0.3 \pm 0.02$  эВ. Присутствие быстро релаксирующих магнитных ионов  $\text{Nd}^{3+}$  вплоть до концентрации в несколько процентов не влияет на ширину линии. Все образцы наряду с контролируемой концентрацией  $C=1 \div 10$  % ионов  $\text{Nd}^{3+}$

содержали малую примесь  $C \leq 0.01\%$  медленно релаксирующих ионов  $Gd^{3+}$ .

Наряду сужением линии ЯМР при повышении температуры во всех изученных системах наблюдается резкое увеличение скорости ядерной спин-решеточной релаксации (рис. 4). Восстановление продольной ядерной намагниченности после  $90^\circ$ -ных импульсов однозначно во всем интервале изменения температуры. Величины  $1/T_1$  в пределах точности эксперимента не зависят от ядерной частоты  $\omega_0$ , направления внешнего магнитного поля  $H_0$  и монотонно увеличиваются в ряду соединений  $KY_3F_{10} - Na_{0.36}Y_{0.64}F_{2.28} - Na_{0.50}Y_{0.50}F_2$ . Отметим наличие максимума на кривых температурной зависимости  $1/T_1$ , положение которого также монотонно сдвигается в этом ряду в область низких температур. Присутствие быстро релаксирующих магнитных ионов  $Nd^{3+}$  существенно не влияет на положение максимума  $T_1^{-1}$ , абсолютная же величина скорости спин-решеточной релаксации заметно изменяется, особенно при низких температурах.

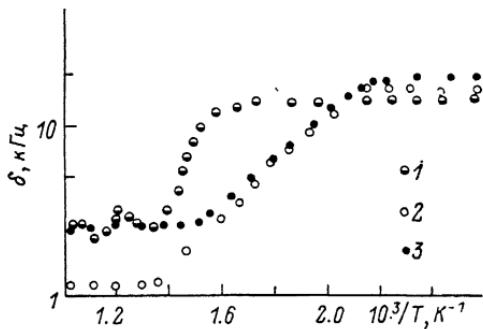


Рис. 3. Сужение линии ЯМР  $^{19}F$  с увеличением температуры монокристалла  $KY_3F_{10}$  (1) и твердых растворов  $Na_{1-x}Y_xF_{1+2x}$  ( $x: 2 — 0.64, 3 — 0.60$ ).

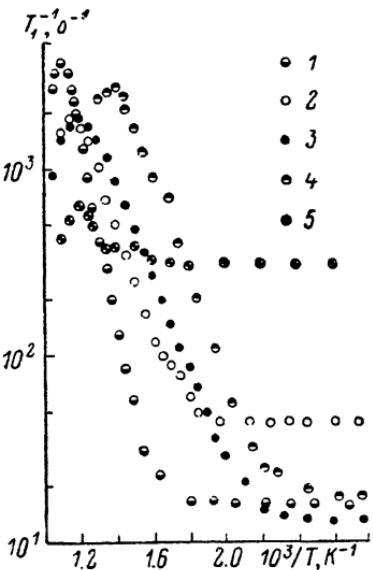


Рис. 4. Зависимость скорости спин-решеточной релаксации от температуры монокристалла  $KY_3F_{10}$  (1) и твердых растворов  $Na_{1-x}Y_xF_{1+2x}$  ( $x: 2 — 0.64, 3 — 0.60, 4 — 0.50$ ) и  $Na_{0.40}Y_{0.60}F_{2.20} - 10\% Nd^{3+}$  (5).

## 2. Интерпретация

Обсудим данные по уширению линии ЯМР  $^{19}F$  (рис. 3). При низких температурах форма линии гауссова, ширина ее не зависит от величины внешнего магнитного поля  $H_0$  и определяется, следовательно, диполь-дипольными взаимодействиями спинов  $I=1/2$  ядер  $^{19}F$ . При повышении температуры вся линия сужается и форма ее становится лоренцевой. Тот факт, что сужение всей линии ЯМР в твердых растворах наступает при более низкой, чем в кристалле  $KY_3F_{10}$ , температуре, а также малая величина энталпии активации  $\Delta E_1 = 0.3$  эВ ионного движения  $F^-$ , приводящего к сужению, свидетельствуют о большей, чем в  $KY_3F_{10}$ , подвижности ионов  $F^-$ .

Чтобы понять, какое именно движение ионов фтора проявляется в обсуждаемом эксперименте, рассмотрим данные работы [1], в которой методом рассеяния нейtronов была определена структура исследуемых твердых растворов. Было показано, что твердые растворы  $Na_{1-x}Y_xF_{1+2x}$  имеют флюоритоподобную структуру, в которой катионы  $Na^+$  и  $Y^{3+}$  случайным образом занимают нормальные для  $CaF_2$  положения. Имеются три типа ионов фтора  $F_1$ :  $8c$  ( $1/4, 1/4, 1/4$ ) — нормальные несмещенные ионы фтора кристалла флюорита,  $F_2:32f$  ( $v, v, v$ ) — смещенные из положений  $F_1$  в направлениях [111];  $F_3:48i$  ( $1/2, w, w$ ) — смещенные в направлениях [110]. Ионы  $F_2$  и  $F_3$  подобны двум единственным типам ионов фтора

кристалла  $\text{KY}_3\text{F}_{10}$ . При изменении  $x$  от 0.54 до 0.64 число ионов  $F_1$  и  $F_2$  уменьшается, а  $F_3$  увеличивается от 6 до 26 % полного их числа. Наиболее подвижны ионы  $F_1$  — при повышении температуры они легко занимают положения  $F_2$ ; наименее подвижны ионы  $F_3$  — число их для состава  $x=0.6$  почти не меняется при увеличении температуры от комнатной до 760 К. Ионы  $F_3$  всегда являются ближайшими соседями ионов  $\text{Y}^{3+}$  и образуют стабильные кубооктаэдрические кластеры.

В соответствии с результатами [1] мы предположим, что сужение линии ЯМР  $^{19}\text{F}$  в твердых растворах происходит вследствие быстрого движения ионов  $F_1$ , которому соответствует наибольшая скорость прыжков  $W_1$  в своей подрешетке. Это движение приводит к эффективному усреднению диполь-дипольного взаимодействия  $\text{F}_1-\text{F}_1$ ,  $\text{F}_1-\text{F}_2$ ,  $\text{F}_1-\text{F}_3$ . Для объяснения сужения всей линии ЯМР необходимо предположить существование быстрого обмена ионов между подрешетками  $F_1$  и  $F_2$ , происходящего со скоростью  $W_{12} \ll W_1$ . Тогда, как это следует из результатов [1], примерно 9/10 интенсивности сигнала ЯМР будет связана с подвижными ионами  $F_1$  и  $F_2$ . Предположение о быстром обмене  $F_1$  и  $F_2$  необходимо также для объяснения результатов эксперимента по ядерной спин-решеточной релаксации  $^{19}\text{F}$ .

Записывая условие начала сужения линии ЯМР  $(W_1 + W_{12})^{-1}\delta_{\text{tp}} \approx 1$ , где  $\delta_{\text{tp}}$  — ширина линии в твердой решетке, и предполагая, что в этой области температур  $W_{12} < W_1$ , получим следующее значение для скорости прыжков ионов  $F_1$ :  $W_1(475 \text{ K}) \approx 1.2 \cdot 10^4 \text{ c}^{-1}$ . Зная величину энтальпии активации  $\Delta E_1 = 0.3 \text{ эВ}$ , вычислим предэкспоненциальный множитель  $W_1^0$  в выражении  $W_1 = W_1^0 \exp(-\Delta E_1/kT)$ :  $W_1^0 = 1.8 \cdot 10^7 \text{ c}^{-1}$ . Столь малая величина  $W_1^0$ , которая коррелирует с малым значением  $\Delta E_1$ , по-видимому, связана с высокой степенью беспорядка, свойственного твердым растворам. Ранее [8, 9] при изучении ионного движения в сильно разупорядоченных твердых электролитах методом ЯМР были также обнаружены аномально малые значения предэкспоненциального множителя типа  $W_1^0$ , определяемые по ширине линии, наряду с малой величиной энтальпии активации. Объяснение этой аномалии было основано либо на предположении о низкоразмерном характере движения ионов в этих сложных системах [8], либо на представлении о том, что термоактивационный процесс прыжка иона не всегда может быть описан законом Аррениуса [9]. Из рис. 3 видно, что для твердого раствора с  $x=0.6$ , для которого ширина линии  $\delta$  в области высоких температур имеет наименьшее значение, близкое к аппаратурному пределу, наклон кривой  $\delta(1/T)$  в конце сужения увеличился. Последнее, как мы предполагаем, связано с тем, что при высоких температурах  $W_{12}$  становится больше  $W_1$  и сужение линии ЯМР  $^{19}\text{F}$  определяется в основном перескоками ионов  $\text{F}^-$  между подрешетками; этому движению соответствует большая энтальпия активации  $\Delta E_{12} > \Delta E_1$ .

Отметим, что в нашем случае в отличие от [10] ионы  $F_1$  и  $F_2$  почти не различаются динамически, поэтому в ЯМР экспериментах не удается выделить группу быстрых ( $\delta_{\text{tp}} < W_1$ ) и медленных ( $\delta_{\text{tp}} > W_{12}, W_2$ ) спинов и наблюдать перенос намагниченности между двумя группами, связанный с атомной диффузией ионов фтора. Следствием этого переноса в работе [10], в которой изучалась ядерная магнитная релаксация  $^{19}\text{F}$  в монокристалле  $\text{LaF}_3$ , явилось увеличение скоростей спин-спиновой и кросс-релаксации быстрых спинов с температурой в некоторой температурной области. Подход [10] в нашем случае оказывается неприменимым и потому, что кросс-релаксационные эксперименты можно поставить только при  $\delta_{\text{tp}} > W_{12}(W_2)$ , когда с помощью определенной последовательности импульсов удается получить условие неравенства проекций намагниченностей быстрых и медленных спинов на направление внешнего магнитного поля.

Время электронной спин-решеточной релаксации крамерсовых ионов  $\text{Nd}^{3+}$  при высоких температурах должно быть достаточно коротким  $\tau_{\text{rel}} \approx 10^{-10} - 10^{-11} \text{ с}$ . Поэтому магнитное поле, действующее на ядра  $^{19}\text{F}$  во

стороны примесных ионов  $Nd^{3+}$ , эффективно усредняется до нуля. Это означает, что ширина линии ЯМР  $^{19}F$  не должна зависеть от концентрации ионов  $Nd^{3+}$ , что находит подтверждение в наших экспериментах вплоть до концентрации 10 %  $Nd^{3+}$ .

Обсудим теперь экспериментальные данные по ядерной спин-решеточной релаксации  $^{19}F$  (рис. 4). При низких температурах скорость релаксации  $T_1^{-1}$  во всех твердых растворах не зависит от температуры и, так же как и в кристалле  $KY_3F_{10}$ , определяется спиновой диффузией к парамагнитным примесям. Номинально чистые изученные твердые растворы содержат быстро и медленно релаксирующие примесные редкоземельные ионы в концентрации  $C \leq 0.01\%$ , и скорость  $T_1^{-1}$  в этих системах при низких температурах примерно равна скорости релаксации в кристалле  $KY_3F_{10}$ : 0.025 %  $Gd^{3+}$ . Увеличение содержания  $Nd^{3+}$  в твердом растворе с  $x=0.6$  до 10 % приводит к увеличению скорости  $T_1^{-1}$  более чем на порядок.

С повышением температуры наблюдается быстрый рост скорости релаксации, которая не зависит в этой области ни от величины, ни от направления внешнего магнитного поля; в наших экспериментах ядерная частота  $\omega_0$  изменялась в пределах  $2\pi(8.5-17.8) \cdot 10^6$  рад·с $^{-1}$ . Одноэкспоненциальный характер релаксации свидетельствует о достаточно быстром переносе намагниченности в системе ядерных спинов.

В [6] было показано, что в кристалле  $KY_3F_{10}$  при высоких температурах ядерная спин-решеточная релаксация  $^{19}F$  связана с модуляцией суперсверхтонкого взаимодействия ядерных спинов  $I$  подвижных ионов  $F^-$  с электронными спинами  $S$  неподвижных примесных ионов  $Gd^{3+}$ . При этом релаксация осуществляется в режиме сильных столкновений [11] — сверхтонкое магнитное поле, действующее на ядерный спин, когда он является ближайшим соседом парамагнитного иона, по порядку величины равно внешнему и время корреляции суперсверхтонкого взаимодействия не мало. В этих условиях времена ядерной релаксации равны друг другу и

$$1/T_1 = 1/T_2 = kC/\tau,$$

где коэффициент  $k \approx 1$  и зависит от типа кристаллической решетки;  $C$  — относительная концентрация парамагнитной примеси [11]. В режиме сильных столкновений ядерный спин теряет фазу и энергию при одном столкновении с электронным спином: скорость ядерной релаксации равна скорости столкновения, не зависит от абсолютной величины энергии взаимодействия и непосредственно связана с временем жизни  $\tau = W^{-1}$  иона, несущего спин  $I$ , в узле кристаллической решетки.

Анализ показывает [6, 11], что только медленно релаксирующие магнитные ионы  $Gd^{3+}$  могут вносить заметный вклад в  $T_1^{-1}$ , так как одним из условий осуществления режима сильных столкновений является неравенство  $|\mathcal{H}'|^2 \tau_{sl}/W \gg \hbar^2$ , выражающее медленность столкновений по сравнению с движением ядерного спина в усредненном за время электронной спин-решеточной релаксации  $\tau_{sl}$ , суперсверхтонком поле;  $\mathcal{H}' = I \vec{A}(t) S$ ,  $\vec{A}(t)$  — тензор взаимодействия. Ядерная релаксация, обусловленная взаимодействием  $^{19}F$  с быстро релаксирующими ионами  $Nd^{3+}$ , осуществляется в режиме слабых столкновений  $|\mathcal{H}'|^2 \tau_{sl}/W \ll \hbar^2$ , и ее скорость мала. Именно поэтому характер температурной зависимости  $1/T_1$  для твердых растворов  $Na_{0.40}Y_{0.60}F_{2.20}$ : 10 %  $Nd^{3+}$  в той области, где происходит изменение скорости релаксации, оказывается таким же, как для номинально чистых образцов.

Происхождение максимума на кривой температурной зависимости  $T_1^{-1}$  от  $T_1^{-1}$  таково: с повышением температуры скорость перескоков ионов фтора  $W$  быстро увеличивается, а время электронной спин-решеточной релаксации  $\tau_{sl}$   $Gd^{3+}$  меняется незначительно ( $\tau_{sl} \approx 10^{-7}$  с, как это следует из уширения линии ЭПР); при температуре, когда  $|\mathcal{H}'|^2 \tau_{sl}/W \approx \hbar^2$ , происходит переключение ядерной релаксации на режим слабых столкновений и  $T_1^{-1}$  уменьшается в соответствии с формулой [11]

$$1/T_1 \approx (1/\hbar^2) |\mathcal{H}'|^2 kC/W, \quad W \geq \tau_{sl}^{-1}.$$

При объяснении экспериментальных данных по спин-решеточной релаксации  $^{19}\text{F}$ , осуществляющейся в режиме сильных столкновений, будем исходить из предположения, что между подрешетками наиболее подвижных ионов  $\text{F}_1$  и  $\text{F}_2$  в системах  $\text{Na}_{1-x}\text{Y}_x\text{F}_{1+2x}$  существует быстрый обмен. Тогда, если время релаксации  $T_1$  (наблюдения) больше, чем характерное время перескоков  $W_{12}^{-1}$  между подрешетками, процесс спин-решеточной релаксации должен быть односекундным с постоянной времени  $T_1$

$$1/T_1 = P_1/T_1^{(1)} + P_2/T_1^{(2)},$$

где  $P_1$ ,  $P_2$  — относительные заселенности состояний  $\text{F}_1$  и  $\text{F}_2$  соответственно;  $1/T_1^{(1)} \approx k_1 C (W_1 + W_{12})$ ;  $1/T_1^{(2)} \approx k_2 C (W_2 + W_{21})$ ;  $W_2$  — скорость перескоков  $\text{F}_2$  в своей подрешетке. Из выражения для  $T_1^{-1}$  следует, что в режиме сильных столкновений скорость спин-решеточной релаксации  $^{19}\text{F}$  должна меняться быстрее с температурой, чем ширина линии ЯМР (рис. 3, 4), так как скорость прыжков  $W_2$  связана с большей энталпийей активации  $\Delta E_2 > \Delta E_{12} > \Delta E_1$ , что и наблюдается на опыте. Различие в абсолютных величинах  $1/T_1$  для твердых растворов  $\text{Na}_{1-x}\text{Y}_x\text{F}_{1+2x}$  с разными значениями  $x$  связано с различием скоростей прыжков  $W$  ионов фтора. Наибольшей подвижностью обладают ионы фтора в твердом растворе с  $x=0.5$ , наименьшей — с  $x=0.64$ . По этой же причине максимум на кривой зависимости  $1/T_1$  от температуры смещается в область высоких температур в указанном ряду. Для твердого раствора с ионами  $\text{Nd}^{3+}$ , замещающими  $\text{Gd}^{3+}$ , концентрация медленно релаксирующих электронных спинов уменьшается, и вместе с ней уменьшается скорость релаксации  $1/T_1$  в области высоких температур.

Обратимся к результатам измерения электропроводности (рис. 2) и предположим, что, так же как и в кристалле  $\text{KY}_3\text{F}_{10}$  [8], перенос заряда в исследованных твердых растворах на макроскопические расстояния связан с более медленным движением ионов  $\text{F}_2$ , которому соответствует скорость прыжков в своей подрешетке  $W_2$  и энталпия активации  $\Delta E_2 = 0.8$  эВ. Эта точка зрения была высказана также в работе [1], авторы которой отмечали, что ионы  $\text{F}_2$  в твердых растворах  $\text{Na}_{1-x}\text{Y}_x\text{F}_{1+2x}$  сравнительно легко смещаются в направлениях [111] кубической элементарной ячейки. Отметим, что перенос заряда в исследованных системах при не слишком высоких температурах осуществляют ионы фтора, которые последовательно занимают положения в подрешетках  $\text{F}_1 - \text{F}_2 - \text{F}_2 - \text{F}_1 = \text{F}_1 \dots$ ; при этом результирующая скорость процесса определяется наиболее медленной его частью, т. е. движением ионов фтора в подрешетке  $\text{F}_2$ .

Различие в абсолютных величинах коэффициента  $\sigma$  твердых растворов связано с изменением концентрации подвижных ионов  $\text{F}_1$  и  $\text{F}_2$ ; так, при переходе от состава с  $x=0.5$  к составу с  $x=0.64$  относительное число подвижных ионов уменьшается в 1.3 раза [1]. Однако величина  $\sigma$  уменьшается в этом ряду более чем на порядок, что обусловлено уменьшением подвижности ионов фтора, связанным с уменьшением скоростей  $W$  (ср. с данными по спин-решеточной релаксации) и длии прыжков.

Проведем приблизительную оценку длины прыжка ионов фтора, связанного с переносом заряда в твердом растворе с  $x=0.6$ . Для этого воспользуемся приближенным выражением для коэффициента электропроводности

$$\sigma \approx (e^2/6kT) (N_1 + N_2) W_2 s^2,$$

полученным в предположении, что все ионы  $\text{F}_1$  и  $\text{F}_2$  с абсолютной концентрацией  $N_1$  и  $N_2$  участвуют в переносе заряда и что наиболее медленной частью движения является движение ионов в подрешетке  $\text{F}_2$ . Тогда, воспользовавшись данными [1] для  $N_1$  и  $N_2$  и положив  $W_2^0 \approx 10^{11} \text{ с}^{-1}$  в выражении  $W_2 = W_2^0 \exp(-\Delta E_2/kT)$ , получим  $s \approx 5 \text{ \AA}$ , что представляется вполне разумным.

Из рис. 2 следует, что при высоких температурах  $T > 670 \text{ K}$  для твердых растворов с  $x=0.6$  и  $0.64$ , в которых относительное число малоподвижных ионов  $\text{F}_3$  наибольшее (равное 0.2 и 0.26 соответственно), в про-

водимости проявляется термоактивационный процесс с большей, чем  $\Delta E_2$ , энталпийей активации. Естественно предположить, что этот процесс соответствует движению ионов  $F_3$ . Учитывая вклад ионов  $F_1$  и  $F_2$  в коэффициент электропроводности, получим энталпию активации диффузионного движения ионов  $F_3$ :  $\Delta E_3 \approx 1.5$  эР.

Таким образом, применение импульсного метода ЯМР на ядрах  $^{19}\text{F}$  и кондуктометрического метода позволило получить достаточно полную информацию о подвижности ионов фтора в твердых растворах состава  $\text{Na}_{1-x}\text{Y}_x\text{F}_{1+2x}$ ;  $0.50 \leq x \leq 0.64$ . Значение коэффициента электропроводности в твердых растворах при  $T=660$  К оказалось меньшим значения в лучшего твердого электролита  $\text{PbF}_2$  лишь на порядок. В исследованных системах удалось выделить три типа движения ионов фтора: быстрое и два медленных. Эти движения совершают ионы фтора, занимающие различные положения в структуре твердых растворов.

Дипольная ширина линии ЯМР наиболее чувствительна к быстрому движению ионов фтора, а коэффициент электропроводности — к медленному. Ядерная спин-релаксация  $^{19}\text{F}$  из-за быстрого обмена ионов между подрешетками быстрых и медленных ионов фтора в твердых растворах имеет скорость, зависящую от относительной концентрации ионов в этих подрешетках.

В системах с высокой ионной подвижностью определяющую роль в спин-решеточной релаксации подвижных ядер играют суперсверхтонкие взаимодействия их с медленно релаксирующими примесными магнитными ионами. Именно для таких систем данные ЯМР наиболее информативны при изучении ионного движения. Присутствие быстро релаксирующих магнитных ионов не оказывается на ЯМР релаксации при высоких температурах, а в области низких температур, увеличивая абсолютную величину скорости релаксации, не позволяет получать полную информацию об ионной подвижности.

#### Список литературы

- [1] Pontonnier L., Patrat G., Aleonard S., Capponi J.-J., Brunel M., de Bergevin F. // Sol. St. Ionics. 1983. V. 9—10. Pt 1. P. 549—554.
- [2] Senegas J., Chartier C., Grannes J. // Sol. St. Chem. 1983. V. 49. N 1. P. 99—106.
- [3] Laborde P., Villeneuve G., Reau J. M., Hagenmuller P. // Z. Anorg. Allg. Chem. 1986. V. 537. N 6. P. 40—52.
- [4] Reau J. M., Matar S., Villeneuve G., SoubeYROUX J. L. // Sol. St. Ionics. 1983. V. 9—10. Pt. 1. P. 563—570.
- [5] Багдасаров Х. С., Каминский А. А., Соболев Б. П. // Кристаллография. 1968. Т. 13. № 5. С. 900—901.
- [6] Тошматов А. Д., Аухадеев Ф. Л., Терпиловский Д. Н., Дудкин В. А., Жданов Р. Ш., Ягудин Ш. И. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 1. С. 111—118.
- [7] Azimi A., Carr V. M., Chadwick A. V., Kirkwood F. G., Sagharian R. // J. Phys. Chem. Solids. 1985. V. 45. N 1. P. 23—31.
- [8] Richards P. M. // Sol. St. Comm. 1978. V. 25. N 12. P. 1019—1021.
- [9] Huberman B., Boyce J. B. // Sol. St. Comm. 1978. V. 25. N 10. P. 759—762.
- [10] Goldman M., Shen L. // Phys. Rev. 1966. V. 144. N 1. P. 321—331.
- [11] Vernon S. P., Thayamballi P., Hogg R. D., Jaccarino V. // Phys. Rev. B. 1981. V. 24. N 7. P. 3756—3771.

Казанский государственный университет  
им. В. И. Ульянова-Ленина

Поступило в Редакцию  
27 января 1989 г.  
В окончательной редакции  
1 февраля 1990 г.